

半导体 α 谱仪在 $\sim(237)\text{Np,Pu},\sim(241)\text{Am},\sim(242)\text{Cm}$ 混合试样鉴定、分析中的应用

@陈恒良 @佟伯廷 @吕峰 @乔盛忠

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本文介绍了应用我们研制的金-硅面垒型半导体 α 谱仪测定 $\sim(237)\text{Np}$ 产品中杂质Pu的方法和精度,分析鉴定离子交换分离的半成品($\sim(241)\text{Am},\sim(242)\text{Cm};\text{Pu}$ 和 $\sim(241)\text{Am}$)质量的方法及其方法的灵敏度和精度。本方法对两种成分 α 放射性比例相近,样品的分析精度小于2%。此外,还介绍了定量测定电沉积样品衰变率的方法,其测量精度小于2%。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(517KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者